

# 日本日立冷场发射扫描电镜SU8600

产品名称	日本日立冷场发射扫描电镜SU8600
公司名称	上海松凯科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本日立 型号:SU8600 产地:日本
公司地址	上海市普陀区叶家宅路100号创享塔园区1号楼东256C
联系电话	13916781349 13916781349

## 产品详情

核心参数：

产品类型：落地式/传统大型

电子枪种类：冷场发射

二次电子图象分辨率：0.6 nm@15kV；0.7nm@1kV

放大倍数：20-2,000,000x

加速电压：0.5-30kV（标准模式）

背散射电子图像分辨率：nm

创新点

1. 支持自动获取数据 在FE-SEM的观察和分析中，需要根据测量样品与需求调整观察条件。调整所需时间的长短取决于用户的操作熟练度，这是造成数据质量与效率差异的因素之一。此系列产品标配自动调整功能，可避免人为操作导致的差异。此外，随着仪器性能的提升，需要获取的数据种类与数量也在增加，手动获取各种大量数据会大大增加用户的作业负担。此系列产品可选配“EM Flow Creator”，用户可根据自身需求设定条件，自动获取数据，这对于未来通过获取大量数据实现数据驱动开发起到重要作用。2. 增加获取信息的种类与数量 通过SEM能够收集到多种信号，且此系列产品\*多可以同时显示和存储6个检测器的信号。在减少图像获取次数的同时能够获取多种信息。

此外，为一次性获取大量信息，像素扩展到了40,960 x 30,720（选配），是之前型号的64倍。利用这一功能，可凭借一张数据图像有效评估多处局部的细微结构。3. 增强信号检测能力 SU8600开发了多个新型选配检测器，加强了对凹凸信息、发光信息的检测能力。此外，还提高了背散射电子信号检测的响应速

度。

上市时间：2021年12月

产品介绍：

FE-SEM获得的图像分辨率高，信息丰富，样品处理相对简单，并且它可以观察、测量并分析样品的细微结构，因此被广泛应用于纳米技术、半导体、电子器件、生命科学、材料等领域。近年来，以Materials Integration为代表，其应用领域及用途在不断扩展，短时间内获取大量数据，减轻作业负荷成为市场的一大需求。为满足这一需求，此次特推出的SU8600系列秉承了Regulus8200系列的高质量图像、大束流分析及长时间稳定运行的冷场成像技术，同时还大大提高了高通量、自动数据获取能力。

在细微结构分析中，SU8600可以实现低加速电压观察，对高分子等易受电子束照射影响的材料进行高分辨观察。该系列产品的特点如下：

## 1. 支持自动获取数据

在FE-SEM的观察和分析中，需要根据测量样品与需求调整观察条件。调整所需时间的长短取决于用户的操作熟练度，这是造成数据质量与效率差异的因素之一。此系列产品标配自动调整功能，可避免人为操作导致的差异。

此外，随着仪器性能的提升，需要获取的数据种类与数量也在增加，手动获取各种大量数据会大大增加用户的作业负担。此系列产品可选配“EM Flow Creator”，用户可根据自身需求设定条件，自动获取数据，这对于未来通过获取大量数据实现数据驱动开发起到重要作用。

## 2. 增加获取信息的种类与数量

通过SEM能够收集到多种信号，且此系列产品\*多可以同时显示和存储6个检测器的信号。在减少图像获取次数的同时能够获取多种信息。

此外，为一次性获取大量信息，像素扩展到了40,960 x 30,720（选配），是之前型号的64倍。利用这一功能，可凭借一张数据图像有效评估多处局部的细微结构。

### 3 . 增强信号检测能力

SU8600开发了多个新型选配检测器，加强了对凹凸信息、发光信息的检测能力。此外，还提高了背散射电子信号检测的响应速度。